09,16

# Наведенные электронным пучком центры окраски и фосфоресценции в прозрачной керамике на основе оксида иттрия с примесью циркония и иттербия

© В.И. Соломонов, А.С. Макарова, А.В. Спирина, В.В. Осипов, А.Н. Орлов, В.А. Шитов

Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия

E-mail: plasma@iep.uran.ru

Поступила в Редакцию 5 июня 2025 г. В окончательной редакции 5 июня 2025 г. Принята к публикации 26 июня 2025 г.

После облучения наносекундными  $(2\,\mathrm{ns})$  пучками электронов со средней энергией  $170\,\mathrm{keV}$  первоначально прозрачные бесцветные образцы керамики составов  $Y_2O_3+5\,\mathrm{mol.\%}\,ZrO_2$  и  $Yb:Y_2O_3+5\,\mathrm{mol.\%}\,ZrO_2$  окрашиваются, а в их спектрах пропускания появляется полоса поглощения при  $487\,\mathrm{nm}$ , которая вместе с интенсивностью окраски возрастает с ростом числа импульсов облучения. После облучения окраска керамики самопроизвольно восстанавливается при комнатной температуре с постоянной времени порядка  $80\,\mathrm{h.}\,$  Показано, что окрашивание керамики обусловлено центрами F-типа. Кроме того, в образцах состава  $Yb:Y_2O_3+5\,\mathrm{mol.\%}\,ZrO_2$  наблюдается фосфоресценция на широкой полосе  $890-1200\,\mathrm{nm}$ , затухающая по гиперболическому закону с характерным временем порядка  $10\,\mathrm{s.}\,$  Предложена модель механизмов окрашивания и обесцвечивания керамики.

**Ключевые слова:** кинетика светопропускания, нанопорошок, спектр пропускания, затухание люминеспенции

DOI: 10.61011/FTT.2025.06.60950.107-25

# 1. Введение

Керамика на основе оксида иттрия, активированного иттербием (Yb: Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), является перспективным материалом для активных элементов мощных лазеров [1-3]. Ион-активатор Yb<sup>3+</sup> имеет простую энергетическую структуру, состоящую из двух уровней: верхнего  ${}^{2}F_{5/2}$ и нижнего <sup>2</sup>F<sub>7/2</sub>, расщепленных в кристаллическом поле на три и четыре штарковских компонентов соответственно. Лазерная генерация на длинах волн 1030 и 1074 nm возбуждается на оптических переходах с нижнего штарковского подуровня <sup>2</sup>F<sub>5/2</sub> на верхние штарковские подуровни <sup>2</sup>F<sub>7/2</sub>. При керамической технологии изготовления активных элементов лазера на основе Yb: Y2O3 используются спекающие добавки, в частности, в виде гетеровалентных ионов циркония [4]. При внешнем высокоэнергетическом воздействии, например, при облучении электронами, на такую керамику возможно пространственное смещение или зарядовое изменение примесных ионов и их окружения. Это может привести к образованию новых наведенных дефектных структур, в т.ч. центров окраски и поглощения. В частности, в [5] с присутствием иона Yb2+ связывают потемнение алюмосиликатных световодов, легированных оксидом иттербия.

Целью работы является исследование кинетики светопропускания (прозрачности) и люминесценции керамики на основе  $Y_2O_3$  с добавлением оксидов  $Yb_2O_3$  и  $ZrO_2$  в зависимости от количества импульсов облучения кера-

мики пучками электронов со средней энергией 170 keV и плотностью энергии в пучке 44.2 mJ/cm<sup>2</sup>.

## 2. Образцы и методы исследования

Исследовались образцы прозрачной керамики на основе оксида иттрия трех составов:  $Yb_{0.1}Y_{1.9}O_3$  — первая группа,  $Y_2O_3+5$  mol.%  $ZrO_2$  — вторая группа и  $Yb_{0.1}Y_{1.9}O_3+5$  mol.%  $ZrO_2$  — третья группа. Для изготовления керамик были использованы нанопорошки соответствующего химического состава.

Нанопорошки были приготовлены методом испарения твердой пористой мишени излучением волоконного иттербиевого лазера [6]. Мишень готовилась из смеси коммерческих микроразмерных порошков оксидов иттрия, иттербия и циркония чистотой 99.99, 99.6 и 99.5%. Оксид иттербия содержанием 5 тоl.% использовался как лазерно-активная примесь. Оксид циркония того же содержания в образцах второй и третьей группы использовался как спекающая добавка. После конденсации паров в воздухе образовывался порошок, основное содержание (98–99%) которого представляли наночастицы соответствующего химического состава со средним размером около 15 пт. Остальное содержание (1–2%) составляли частицы микронного и субмикронного размера.

Фазовый состав порошков измерялся на дифрактометре D8 Discover с графитовым монохроматором на диафрагмированном луче ( $\lambda=0.1542\,\mathrm{nm}$  —  $K_{\alpha1,2}$  меди). Показано, что частицы кристаллизовались в мо-

Группа	Химический состав	Обжиг компакта в воздухе	Спекание в вакууме	ГИП в аргоне	Просветляющий обжиг керамики в воздухе
1	Yb <sub>0.1</sub> Y <sub>1.9</sub> O <sub>3</sub>	800 °C 3 h	1400 °C 1 h	1500 °C 2 h	1200 °C 10 h
2	$Y_2O_3 + 5 mol.\% ZrO_2$	800 °C 3 h	1780 °C 20 h	_	1400 °C 2 h
3	$Yb_{0.1}Y_{1.9}O_3 + 5 \text{ mol.}\% ZrO_2$	900 °C 3 h	1750 °C 5 h	_	1400 °C 2 h

Условия температурной обработки переделов нанопорошков, необходимых для синтеза оптических керамик

ноклинной фазе. После обжига на воздухе при температуре 900—1100°С в течение 3 h частицы переходили в кубическую фазу. Данный режим фазовой трансформации сопровождался незначительной агломерацией наночастиц, о чем свидетельствовало уменьшение удельной поверхности частиц, измеренной методом Брунауэра—Эммета—Теллера. Вторых фаз в нанопорошках в пределах погрешности измерений не было обнаружено.

Полученные нанопорошки без добавления каких-либо органических связующих одноосным статическим прессованием под давлением 200 МРа компактировались в диски диаметром  $\sim 15\,\mathrm{mm}$  и толщиной  $3{-}4\,\mathrm{mm}$  плотностью около 45% относительно теоретической плотности кристалла. Полученные компакты обжигались в атмосферной печи с целью снятия механических напряжений и удаления органических соединений. Образцы керамики первой группы были синтезированы с использованием методики горячего изостатического прессования (ГИП) на установке AIP HIP 6-30H (American Isostatic pressing, США) под давлением 200 MPa при предварительном спекании в вакуумной печи. Синтез керамик второй и третьей групп проводился в вакуумной печи с вольфрамовыми нагревателями при остаточном давлении  $1 \cdot 10^{-3}$  Ра. Получение высокого вакуума обеспечивалось за счет использования связки спирального (ANEST IWATA, Япония) и турбомолекулярного (Shimadzu, Япония) насосов. Затем все образцы подвергались просветляющему обжигу на воздухе. В таблице представлены условия температурной обработки для переделов нанопорошка каждой группы.

Рентгенофазовый анализ показал, что кристаллическая структура керамики представляет собой твердый раствор примесных элементов (Yb, Zr) в кубической решетке оксида иттрия.

Облучение образцов керамики осуществлялось в установке КЛАВИ [7] на воздухе при комнатной температуре импульсными электронными пучками со средней энергией электронов 170 keV, плотностью электронного тока 130 A/cm² и плотностью энергии в импульсе 44.2 mJ/cm² при длительности 2 ns. Частота импульсов облучения составляла 1 Hz.

Спектры пропускания до и после облучения образцов керамики измерялись на спектрофотометре Shimatzu UV-1700 в диапазоне от 200 до 1100 nm.

Для регистрации фосфоресценции образцов после их облучения электронными пучками излучение с поверхности образца посредством кварцевого световода через механический модулятор направлялось на фотокатод ФЭУ. При этом с целью определения спектрального диапазона полосы фосфоресценции использовались ФЭУ-62 (рабочий диапазон 400—1200 nm) или ФЭУ-100 (200—800 nm), а также светофильтры. Сигналы с ФЭУ регистрировались с помощью микропроцессорного блока управления монохроматором МДР-41 при использовании программного обеспечения MdrWin.

Кинетика полосы излучения иона  $Yb^{3+}$  при  $1030\,\mathrm{nm}$  регистрировалась фотоумножителем  $\Phi$ ЭУ-62 и осциллографом KeySight DSOX 2014A ( $100\,\mathrm{MHz}$ ) при облучении одиночными импульсами электронного пучка. Полоса выделялась монохроматором МДР-41 с входным фильтром  $1.0-1.5\,\mu\mathrm{m}$  и дифракционной решеткой  $1200\,\mathrm{grooves/mm}$  при ширине входной щели  $2\,\mathrm{mm}$  (ширина регистрируемой области спектра составляла  $5\,\mathrm{nm}$ ).

### 3. Результаты исследований

До облучения импульсным электронным пучком все образцы керамики были бесцветными и прозрачными. После облучения образцы керамики первой группы  $(Yb_{0.1}Y_{1.9}O_3)$  оставались бесцветными, тогда как образцы керамики третьей группы  $(Yb_{0.1}Y_{1.9}O_3+5\text{ mol.}\%\,ZrO_2)$  окрашивались в оранжеворозовый цвет (рис. 1). Их окрашивание также наблюдается при облучении ртутной бактерицидной лампой ( $\lambda=254\,\mathrm{nm}$ ). Образцы керамики второй группы  $Y_2O_3+5\,\mathrm{mol.}\%\,ZrO_2$  после облучения электронными пучками также окрашивались, но с меньшей насыщенностью цвета. Вследствие низкой цветопередачи фотоаппарата не удалось получить фотографию данных керамик с отчетливой границей облученной и необлученной половин образцов, поэтому она не приводится.

Спектры пропускания образцов керамики всех трех групп до и после облучения электронными пучками приведены на рис. 2. В образцах первой группы спектр

$$\begin{split} &[(Yb_{0.05}Y_{0.95})_2O_3]_{0.95}(ZrO_2)_{0.05}\\ &[(Yb_{0.05}Y_{0.95})_2O_3]_{0.95}(ZrO_2)_{0.05}\\ &[(Yb_{0.05}Y_{0.95})_2O_3]_{0.95}(ZrO_2)_{0.05}\\ &[(Yb_{0.05}Y_{0.95})_2O_3]_{0.95}(ZrO_2)_{0.05} \end{split}$$

**Рис. 1.** Фотография образца керамики  $Yb_{0.1}Y_{1.9}O_3 + 5 \, \text{mol.}\% \, ZrO_2$ , половина которого облучена 500 импульсными электронными пучками (верхняя), а вторая половина экранирована свинцовой пластиной (нижняя).

пропускания до и после облучения качественно не изменяется (рис. 2,a). В спектрах пропускания образцов первой и третьей групп наблюдаются сильные линии поглощения иона  $Yb^{3+}$  (рис. 2,a и c), а после облучения в спектрах пропускания образцов второй и третьей групп дополнительно появляется широкая полоса поглощения с максимумом при 487 nm (рис. 2,b и c), более сильная у образцов третьей группы (рис. 2,c). С увеличением числа импульсов облучения от 1 до 500 образцов третьей группы поглощение (оптическая плотность) в этой полосе нарастает (рис. 3,a), а после облучения падает по почти экспоненциальному закону с характерным временем обесцвечивания  $\tau_{\rm dc} \approx 80$  h (рис. 3,b).

В области 200-400 nm наблюдалось увеличение светопропускания облученных электронными пучками образцов третьей группы (рис. 2, c), при этом разность коэффициентов пропускания облученного и необлученного образца постепенно уменьшалась в течение 20 min после прекращения внешнего воздействия. По истечении этого времени спектр пропускания в УФ-области стал соответствовать спектру образца, не подвергнутому облучению (рис. 2, c, черная кривая). Просветление является ложным и происходит в результате инструментальных искажений, связанных с наличием в облученных образцах фосфоресценции в невидимой для глаза области спектра. В спектральном диапазоне чувствительности ФЭУ-100 не было зафиксировано свечения образцов, тогда как ФЭУ-62 устойчиво регистрировал их длительное послесвечение (рис. 4, a). Уточнить структуру этой полосы с помощью монохроматора нам не удалось изза низкой спектральной плотности излучения. Однако использование светофильтров позволило сузить спектральный диапазон полосы фосфоресценции пределами 890-1200 nm. Ее затухание (рис. 4, b) с коэффициентами корреляции  $R_2 = 0.99$  описывается как суммой двух экспонент типа

$$I_{\rm p} = A \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + B \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right)$$
 (1)

с характерными временами  $au_1 \approx 10.4\,\mathrm{s}$  и  $au_2 \approx 145\,\mathrm{s}$  (рис. 4, *b*, красные пунктирные прямые), так и гипербо-

лическим законом

$$I(t) = I_0 \left( 1 + \frac{t}{\tau} \right)^{-2} \tag{2}$$

с  $\tau \approx 10\,\mathrm{s}$  (рис. 4, *b*, зеленая пунктирная прямая), где I(t) и  $I_0$  — текущая и начальная интенсивность фосфоресценции.

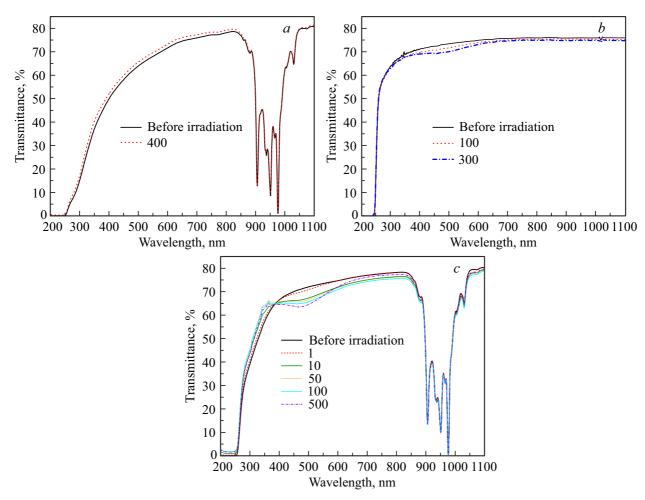
Для образцов третьей группы регистрировалась кинетика затухания импульсной катодолюминесценции на полосе 1030 nm, соответствующей лазерному переходу иона Yb<sup>3+</sup>. Кривые затухания люминесценции снимались для каждого предварительно необлученного образца после 1-го, 10-го, 20-го, 30-го, . . . , 200-го импульса облучения. Время между измерениями составляло около 1 min. Кривые затухания фототока  $I_p$  для всех образцов оказались подобными (рис. 5).

Все кривые затухания  $I_p$  образцов третьей группы после первого импульса облучения с коэффициентом корреляции  $R_2>0.96$  описываются суммой двух экспонент (1) с характерными временами  $\tau_1=70.2\pm5.1\,\mu\text{s}$  и  $\tau_2=1.64\pm0.08$  ms. (Здесь в качестве погрешности принят разброс этих величин по 9 измерениям — количеству образцов третьей группы). С возрастанием числа импульсов облучения до  $N\approx60$  длительная компонента  $\tau_2$  имеет тенденцию к снижению с 1.64 до 1.48 ms, но при  $N\geq60$  оба характерных времени сохраняют свои значения в пределах  $\tau_1=70.0\pm4.4\,\mu\text{s}$  и  $\tau_2=1.51\pm0.07$  ms. Отношение коэффициентов A/B возрастает при увеличении N до 60, а при  $N\geq60$  сохраняет свое значение  $6.2\pm0.4$ .

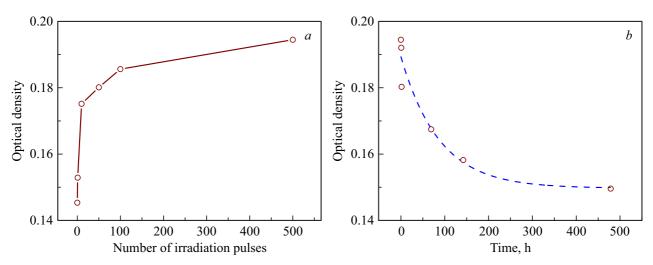
При фотовозбуждении лазерным диодом с длиной волны 976 nm тех же образцов керамики кинетика этой полосы хорошо описывается одной экспоненциальной функцией с характерным временем, находящемся во временном диапазоне  $\tau_2$ .

# 4. Обсуждение результатов

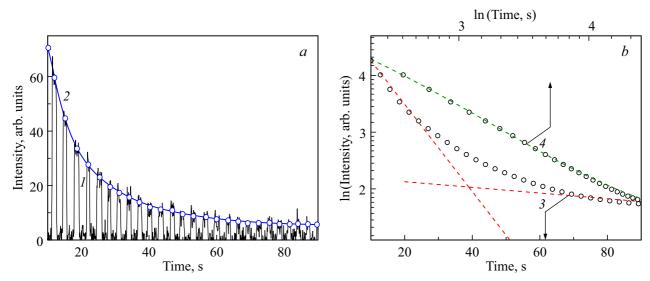
Во всех образцах керамики до облучения электронным пучком оптически активные центры не проявляются (рис. 2). Воздействие электронного пучка стимулирует перестройку дефектов и их оптическую активацию в керамике второй и третьей групп (с оксидом циркония в качестве спекающей добавки). Поэтому появляющаяся в этой керамике после облучения электронным пучком полоса поглощения при 487 nm опосредованно связана с наличием в ней четырехвалентных ионов Zr<sup>4+</sup>. Сам ион Zr<sup>4+</sup>, имеющий замкнутую электронную оболочку, является оптически неактивным в видимой области спектра. Трехвалентные ионы циркония, которые могут присутствовать или создаваться в керамике электронами пучка, должны проявляться в поглощении на  $d \rightarrow d$ - $(E \rightarrow T_2)$  переходах в более длинноволновой области 590-620 nm. В люминесценции трехвалентные ионы циркония в керамике оксида иттрия проявляются на полосах при  $\lambda \approx 818$  и 900 nm [8].



**Рис. 2.** Спектры пропускания образцов керамики a) первой, b) второй и c) третьей групп до и после облучения разным количеством (указано на рисунке) импульсов электронов.

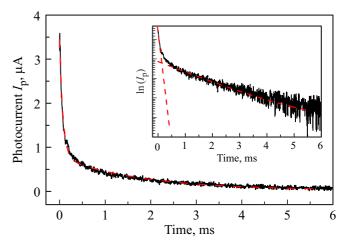


**Рис. 3.** Изменение оптической плотности в полосе поглощения при  $487\,\mathrm{nm}$  образцов третьей группы с увеличением числа импульсов облучения электронным пучком (a) и со временем после облучения 500 импульсами (b). Синяя пунктирная кривая — результат аппроксимации экспоненциальной функцией.



**Рис. 4.** Кинетика фосфоресценции образца керамики третьей группы после облучения электронами: a) сигнал с ФЭУ-62: кривая I — исходный модулированный сигнал фосфоресценции, 2 — огибающая по максимумам кривая; b) определение характерного времени затухания: 3 — кривая 2 в логарифмических координатах по оси интенсивности, красные пунктирные прямые — аппроксимация функцией (1), 4 — кривая 2 в логарифмических координатах по оси интенсивности и времени, пунктирная зеленая прямая — результат аппроксимации функцией (2).

Спектральное положение и кинетика широкой полосы поглощения при 487 nm хорошо соответствуют центру F-типа. В оксиде алюминия подобная полоса поглощения при 490 nm приписывается  $F_2^{2+}$ -центру [9]. Такие центры могут возникать и в кристаллической решетке  $Y_2O_3$ кубической фазы, содержащей цирконий. В ней ионы  $Zr^{4+}$  замещают основные катионы  $Y^{3+}$ , которые располагаются в центре элементарного куба YO<sub>6</sub>. Причем в 3/4 этих кубов естественные кислородные вакансии находятся на вершинах вдоль диагонали грани, а в 1/4 вдоль пространственной диагонали [10]. При вхождении ионов циркония в четырехвалентном состоянии для компенсации их электрического заряда элементарные кубы могут достроиться до ZrO<sub>8</sub> за счет смещения ионов кислорода из соседних элементарных кубов. В результате часть этих соседних кубов превращается в искаженные полиэдры с кислородными вакансиями (V<sub>O</sub>). Кроме того, в керамике из оксида иттрия присутствуют кислородные вакансии, образующиеся при высокотемпературном спекании керамики в вакууме за счет испарения кислорода. Последующий просветляющий отжиг на воздухе полностью не компенсирует дефицит кислорода. Таким образом, полосу поглощения при 487 nm, присутствующую в образцах керамики из оксида иттрия с добавлением оксида циркония в качестве спекающей добавки, следует связать с центром поглощения F-типа. Причем этот центр образуется во время действия электронного пучка при захвате кислородными вакансиями свободных электронов. Образующиеся при этом центры окраски F-типа являются относительно долгоживущими. В первые 478 h после облучения электронным пучком спад



**Рис. 5.** Затухание фототока  $I_{\rm p}$  от люминесценции на длине волны 1030 nm образца третьей группы. Пунктирная красная линия — результат аппроксимации функцией (1). На вставке приведена кривая затухания в логарифмическом масштабе по оси  $I_{\rm p}$ .

оптической плотности на полосе поглощения протекает по экспоненциальному закону с характерным временем около 80 h.

Фосфоресценция в области 890—1200 nm наблюдается только в образцах керамики третьей группы после их облучения электронным пучком. Это позволяет предположить, что в формировании излучающих ее центров принимают участие ионы иттербия и циркония. Гиперболический характер затухания этой полосы фосфоресценции

позволяет предположить, что она является результатом излучательной рекомбинации электронного и дырочного центров. В качестве таковых могут выступать ионы Yb<sup>2+</sup> и  $O^{1-}$ , образующиеся в результате переноса заряда во время действия электронного пучка в искаженных ионом Zr<sup>4+</sup> полиэдрах. Ранее [4] при исследовании спектров комбинационного рассеяния лазерного излучения на длине волны 785 nm в образцах третьей группы была обнаружена широкая полоса фотолюминесценции 890-1050 nm. В [4] показано, что эта полоса имеет сложный состав. В нее входят ИК-полосы излучения иона Yb<sup>3+</sup>. Фотовозбуждение на длине волны 785 nm указывает на то, что эти центры могут присутствовать и в предварительно необлученных электронным пучком образцах. В частности, они могут представлять собой ионы  $Yb^{2+}$ , расположенные в искаженных полиэдрах или стабилизированные радикалами органики, в небольших количествах присутствующих в образцах.

В настоящее время спектральное положение энергетических уровней иона Yb2+ в оксиде иттрия экспериментально однозначно не выявлено. Исходя из справочных данных для свободного иона  $Yb^{2+}$  и штарковского расщепления в кристаллическом поле кубической симметрии [11,12], уровни конфигурации  $4f^{13}5d^1$  этого иона располагаются на  $(30-55) \cdot 10^3 \, \text{cm}^{-1}$  выше основного состояния  $4f^{14}(^1S_0)$ . При ширине запрещенной зоны в оксиде иттрия около  $40000\,\mathrm{cm}^{-1}$  (250 nm, граница фундаментального поглощения на рис. 2) верхняя энергетическая зона орбитального триплета  $4f^{13}5d^{1}(^{2}F_{5/2}t_{2g})$ располагается в зоне проводимости, тогда как нижняя зона триплета  $4f^{13}5d^{1}(^{2}F_{7/2}t_{2g})$  и две зоны орбитального дублета  $4f^{13}5d^1(^2F_{7/2,5/2}e_g)$ , так же, как в иттрийалюминиевом гранате [11], могут располагаться в запрещенной зоне. Переходы из основного состояния иона  $Yb^{2+}$  на эти уровни должны проявляться в виде полос поглощения в видимой и ультрафиолетовой областях спектра. Однако в спектрах пропускания (рис. 2) керамики, содержащей иттербий, отсутствуют полосы поглощения, которые можно связать с этими переходами.

В то же время энергетическое положение уровней иона  $Yb^{2+}$  в искаженных ионом  $Zr^{4+}$  полиэдрах может быть существенно другим. А именно, уровни зон орбитального дублета  $4f^{13}5d^{1}(^{2}F_{7/2.5/2}e_{g})$  могут иметь более низкое положение, достаточное для их возбуждения излучением с длиной волны 785 nm [4]. Причем, при облучении образцов электронным пучком может осуществляться дополнительная генерация ионов Yb<sup>2+</sup> путем захвата свободного электрона возбужденным ионом  $Yb^{3+}(^2F_{5/2})$  с характерным временем 70 µs. Этот процесс отражается в кинетике затухания импульсной катодолюминесценции на полосе 1030 nm (рис. 5). В ней четко проявляются два экспоненциальных механизма спада интенсивности с характерными временами:  $\tau_1 = 70.2 \pm 5.1 \,\mu\text{s}$  и  $\tau_2 = 1.64 \pm 0.08 \,\text{ms}$ , тогда как при фотовозбуждении лазерным диодом с длиной волны 976 nm тех же образцов керамики в кинетике этой полосы отсутствует быстрая составляющая  $\tau_1$ . Поэтому следует считать, что характерное время  $au_2 = 1.64 \pm 0.08\,\mathrm{ms}$  есть время жизни уровня  $^2\mathrm{F}_{5/2}$  иона Yb<sup>3+</sup>, а  $au_1 \approx 70.2 \pm 5.1 \,\mu s$  отражает скорость девозбуждения излучательного уровня  ${}^2F_{5/2}$  путем захвата электрона. Отсюда можно оценить вклад дополнительного механизма девозбуждения в интегральную интенсивность полосы при 1030 nm иона Yb<sup>3+</sup> как

$$(A \cdot \tau_1)/(B \cdot \tau_2) \approx 0.15 - 0.28.$$
 (3)

Здесь А и В — коэффициенты аппроксимирующей формулы (1). В первом приближении выражение (3) дает оценку отношения содержаний двух- и трехвалентных ионов иттербия в образцах.

## Заключение

В ходе проведенных исследований установлено, что в образцах керамики на основе оксида иттрия, содержащих оксид циркония  $(Y_2O_3 + 5 \text{ mol.}\% \text{Zr}O_2)$ и  $Yb: Y_2O_3 + 5 \text{ mol.}\% ZrO_2)$  после облучения наносекундными пучками электронов со средней энергией 170 keV и плотностью тока 130 A/cm<sup>2</sup> возникают центры окраски F-типа. Их самопроизвольный распад при комнатной температуре осуществляется по экспоненциальному закону с характерным временем около 80 h.

В образцах керамики, содержащей цирконий и иттербий  $(Yb: Y_2O_3 + 5 \text{ mol.} \% ZrO_2)$ , после облучения электронным пучком наблюдается фосфоресценция с гиперболическим законом спада интенсивности. Центр фосфоресценции представляет собой нестабильную электронно-дырочную пару с основой  $Yb^{2+}-O^{1-}$ .

Предполагается, что эти наблюдаемые эффекты обусловлены искажением кристаллических полиэдров в окрестностях примесных ионов циркония.

#### Финансирование работы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-19-20074, https://rscf.ru/project/24-19-20074/, при финансовой поддержке со стороны Правительства Свердловской области.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] S.N. Bagayev, V.V. Osipov, V.A. Shitov, E.V. Pestryakov, V.S. Kijko, R.N. Maksimov, K.E. Lukyashin, A.N. Orlov, K.V. Polyakov, V.V. Petrov. J. Eur. Ceram. Soc. 32, 16, 4257
- [2] J. Lu, K. Takaichi, T. Uematsu, A. Shirakawa, M. Musha, K. Ueda, H. Yagi, T. Yanagitani, A.A. Kaminskii. Jpn. J. Appl. Phys. 41, 12A, L1373 (2002).

- [3] K. Takaichi, H. Yagi, J. Lu, J.-F. Bisson, A. Shirakawa, K. Ueda, T. Yanagitani, A.A. Kaminskii. Appl. Phys. Lett. 84, 3, 317 (2004).
- [4] В.И. Соломонов, В.В. Осипов, В.А. Шитов, Р.Н. Максимов, А.В. Спирина, А.С. Макарова, А.Н. Орлов, О.Н. Чайковская, А.А. Щукина, М.С. Снегерев, Ю.В. Кистенев. ЖПС 92, 3, 326 (2025).
- [5] К.К. Бобков, А.А. Рыбалтовский, В.В. Вельмискин, М.Е. Лихачев, М.М. Бубнов, Е.М. Дианов, А.А. Умников, А.Н. Гурьянов, Н.Н. Вечканов, И.А. Шестакова. Квантовая электроника 44, 12, 1129 (2014). [К.К. Bobkov, А.А. Rybaltovsky, V.V. Vel'miskin, M.E. Likhachev, M.M. Bubnov, E.M. Dianov, A.A. Umnikov, A.N. Gur'yanov, N.N. Vechkanov, I.A. Shestakova. Quantum Electron. 44, 12, 1129 (2014).]
- [6] V.V. Osipov, V.V. Platonov, V.V. Lisenkov, E.V. Tikhonov, A.V. Podkin. Appl. Phys. A 124, 1, 3 (2018).
- [7] V.I. Solomonov, S.G. Michailov, A.I. Lipchak, V.V. Osipov, V.G. Shpak, S.A. Shunailov, M.I. Yalandin, M.R. Ulmaskulov. Laser Phys. 16, 1, 126 (2006).
- [8] В.И. Соломонов, А.В. Спирина, С.Ф. Конев, С.О. Чолах. Опт. и спектр. 116, 5, 862 (2014). [V.I. Solomonov, A.V. Spirina, S.F. Konev, S.O. Cholakh. Opt. Spectrosc. 116, 5, 793 (2014).]
- [9] Д.В. Ананченко, С.В. Никифоров, Г.Р. Рамазанова, Р.И. Баталов, Р.М. Баязитов, Г.А. Новиков. Опт. и спектр. **128**, *2*, 211 (2020). [D.V. Ananchenko, S.V. Nikiforov, G.R. Ramazanova, R.I. Batalov, R.M. Bayazitov, H.A. Novikov. Opt. Spectrosc. **128**, *2*, 207 (2020).]
- [10] G. Schaack, J.A. Koningstein. J. Opt. Soc. Am. 60, 8, 1110 (1970).
- [11] М.В. Еремин. Опт. и спектр. 29, 1, 100 (1970).
- [12] T.S. Piper, J.P. Brown, D.S. McClure. J. Chem. Phys. 46, 4, 1353 (1967).

Редактор Е.В. Толстякова